熱活性化遅延蛍光材料の項間交差速度の評価

Estimation of intersystem crossing rate of thermally activated delayed fluorescence emitters ^O川手 大輔¹, 丹羽 顕嗣¹, 小林 隆史^{1,2}, 永瀬 隆^{1,2}, 合志 憲一^{3,4}, 安達 千波矢^{3,4}, 内藤 裕義^{1,2} (1. 大阪府大工, 2. 大阪府大 RIMED, 3. 九大 OPERA, 4. 九大 JST-ERATO 安達分子エキシトン工学プロジェクト) ^OD. Kawate¹, A. Niwa¹, T. Kobayashi^{1,2}, T. Nagase^{1,2}, K. Goushi^{3,4}, C. Adachi^{3,4}, H. Naito^{1,2} (1. Osaka Pref. Univ., 2. RIMED, 3. OPERA, Kyushu Univ., 4. JST-ERATO, Kyushu Univ.) E-mail: <u>daisuke.kawate.oe@pe.osakafu-u.ac.jp</u>

はじめに これまで我々は熱活性化遅延蛍光 (TADF)材料の発光緩和過程に、 $S_1 \ge T_1$ に加え て高次の三重項励起状態 T_n も関与することを 明らかにしてきた[1,2]。しかし、Fig.1に示す 4 準位モデルでは、発光緩和過程に関与する 緩和速度定数が多く存在するため、各緩和速 度定数を正確に決定することはできていなか った。本研究では、項間交差速度定数(Fig.1に おける $k_{isc1}+k_{isc2}$)の評価を試みたので、その結 果について報告する。

解析 Fig.1にT_nを考慮したTADF材料の4準 位モデルを示す。室温の場合、励起状態が生 成されてから緩和するまでに、ここに示す全 ての緩和速度定数が影響するため、解析は極 めて複雑である。しかし、逆過程($k_{risc1}, k_{risc2}, k_{ric}$)が無視できる極低温であれば、実験的に観 測される速い発光緩和速度(k_1)はS₁からの輻 射緩和速度と項間交差速度の和($k^{S}+k_{isc1}+k_{isc2}$) に、遅い発光緩和速度(k_2)はT₁からの燐光緩 和速度(k^{T_1})になる。さらに、極低温における発 光減衰の時刻 t=0 の値を1 に規格化すると、 燐光成分の時刻 t=0 における発光強度(I_{phos})は、 次式のように近似できる。

$$I_{\text{phos}} = \frac{k_1 - k^S}{k_1} \times \frac{k_2}{k^S} \tag{1}$$

従って、発光緩和速度 k_1 、 k_2 及び燐光成分の t=0の値から、 k^s と $k_{isc1}+k_{isc2}$ を求めることが できる。

実験 TADF 材料には、1,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyanobenzene (4CzIPN)及び 1,2-bis(carbazol-9-yl)-4,5-dicyanobenzene (2CzPN)を用 いた。ホスト材料には 1,3-bis(9-carbazolyl)benz ene (m-CP)を用い、それぞれ 5 wt%の濃度でホ スト材料に分散したドープ膜をスピンコート 法により成膜した。発光減衰測定は複数の測 定手法を用い、10⁻⁹~10⁻³ s までの領域で行った。 ただし、励起子の対消滅が生じないように励 起光強度を十分に弱くして測定を行った。

<u>結果及び考察</u> 極低温で得られた 4CzIPN の発 光減衰曲線を Fig. 2 に示す。固体薄膜中にお いて、4CzIPN 及び 2CzPN の発光減衰は非指 数関数的になり、k₁、k₂の値を正確に決めるこ とができないため、ここでは緩和速度の範囲 を決めることにする。4CzIPNの場合、 $k_1 \ge k_2$ を Fig. 2 に示す値を用い、式(1)を計算すると、 $k^{s}=3\sim5\times10^7 s^{-1} \ge cx$ り、 $k_{isc1}+k_{isc2}=2\sim3\times10^5 s^{-1} \ge cx$ の。2CzPNの場合、 $k^{s}=3\sim6\times10^7 s^{-1} \ge cx$ り、 $k_{isc1}+k_{isc2}=1\sim3\times10^4 s^{-1} \ge cx$ の。極低温において、 4 準位モデルにおける項間交差速度定数の値 を得ることができた。 $k_{isc1}+k_{isc2}$ は室温と極低 温で異なり、その温度依存性については当日 議論する。



Fig. 1 Energy diagram considering T_n.



Fig. 2 PL decay curve of 4CzIPN-doped thin film at 10 K.

謝辞 本研究の一部は、科学研究費補助金 (17H01265, 15H03883, 15J12038)の助成を受けた。

参考文献 [1] T. Kobayashi *et al.*, Phys. Rev. Applied, 7, 034002 (2017). [2] 川手他, 第 63 回 応用物理学会秋季学術講演会 17a-P5-8 (2017).